

о геометрической толщине проводящих пленок,
описываемых импедансной моделью

Е. А. Быноградов, В. И. Голованов, Н. А. Ирисова,
А. Б. Латышев

УДК 539.216.2

Экспериментально показано, что при $\lambda \sim 1 - 2$ мм геометрическая толщина неоднородных металлических пленок, описываемых импедансной моделью, может достигать десятков микрон, что на несколько порядков превышает оценки толщины аналогичных пленок, сделанные в предположении их однородности по толщине.

Известно, что электродинамические свойства некоторых тонких электропроводящих пленок в ИК-СВЧ диапазонах можно аналитически описывать при помощи импедансной модели /1-4/. В этом случае реальная пленка уподобляется плоскости нулевой толщины, не вносящей разрыва в тангенциальную компоненту электрического поля, но обуславливающей разрыв тангенциальной компоненты магнитного поля волны, величина которого определяется импедансом пленки Z . Будем в дальнейшем называть пленки, описываемые импедансной моделью, электродинамически тонкими. В работах /5-7/ нами экспериментально показано, что при длинах волн $\lambda \sim 1$ мм пленки многих металлов, полученные вакуумным напылением на лавсановую подложку и имеющие энергетическое пропускание $T > 10^{-3}$, являются электродинамически тонкими.

Часто задаются вопросом: каковы геометрические толщины тонких металлических пленок? Этот вопрос возникает при попытках определения геометрической толщины d пленок путем зондирования излучением ИК-СВЧ диапазонов, а также при попытках использования толщины пленки, измеренной каким-либо иным способом, в качестве критерия применимости к ней импедансной модели /8/. Например, в работах /9-11/ пленку рассматривали как плоско-

параллельный однородный по толщине^{*)} слой проводящего вещества с известными параметрами, имеющий толщину d_1 , много меньшую скрин-слоя (при $\lambda \sim 1$ мм $d \ll 0,1$ мкм). При этих условиях энергетическим пропусканиям T , лежащим в пределах от единиц до десятков процентов, соответствуют толщины металла от долей до сотни ангстрем.

В настоящей работе экспериментально показано, что существуют электродинамически тонкие, неоднородные по толщине проводящие пленки, с геометрической толщиной, много большей скрин-слоя при данной частоте. По методике работ /5-7/ были определены при $\lambda \sim 1 - 2$ мм коэффициенты пропускания и отражения пленок, полученных вакуумным напылением различных металлов на одну сторону лавсановой подложки толщиной $d_1 \sim 10$ мкм. Было выяснено, что все они электродинамически тонки, а измеренные величины их импедансов z_i ($i = 1, 2, \dots$) вещественны и не зависят от частоты. Затем пленки попарно накладывались вплотную друг на друга металлизированными сторонами наружу. У таких комбинированных пленок были измерены зависимости величин T от угла падения Θ для s - и p -поляризаций. Результаты проиллюстрированы на рис. I, где приведены также и теоретические зависимости, которые были рассчитаны по соотношениям импедансной модели /3-5/

$$T_s = \left| \frac{2Z \cos \Theta}{W + 2Z \cos \Theta} \right|^2, \quad T_p = \left| \frac{2Z}{W \cos \Theta + 2Z} \right|^2, \quad (1)$$

где W – волновое сопротивление окружающей среды ($W = 377$ Ом), а Z – параметр модели. Величина Z для каждой комбинированной пленки определялась двумя способами: во-первых ($Z = Z^s$), из условия наилучшего совпадения выражений (1) с экспериментом при значениях Θ , близких к нулю, во-вторых ($Z = Z^t$), из соотношения

$$Z = Z_{i,j}^t = (z_i z_j) / (z_i + z_j), \quad (2)$$

где z_i и z_j – измеренные импедансы одиночных пленок.

Из рис. I видно, что когда теоретические кривые, полученные для Z , выбранного двумя различными способами (штриковая при

^{*)} Известно, что для реальных тонких металлических пленок эти предположения обычно не выполняются /12/.

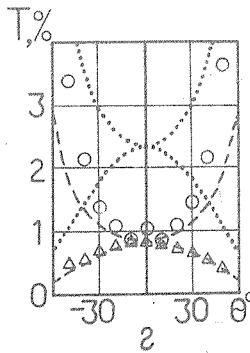
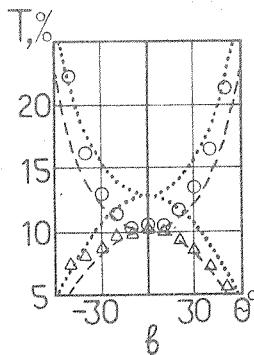
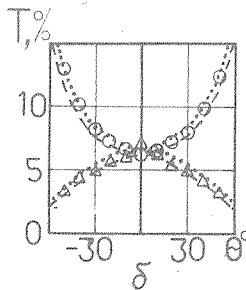
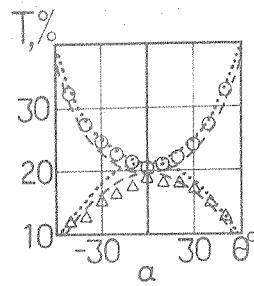


Рис. I. Экспериментальные зависимости коэффициентов пропускания по мощности Т комбинированных пленок, составленных из одиночных пленок с импедансами z_i и z_j , от угла падения θ при s -поляризации (Δ) и p -поляризации (\circ) и расчетные кривые (формула (I)) для аналогичных зависимостей, соответствующие импедансам $Z_{i,j}^t$ (пунктирные кривые) и $Z_{i,j}^e$ (штриховые кривые):
 а) $z_1 = 267 \text{ Ом}$; $z_2 = 418 \text{ Ом}$; $z_{1,2}^t = 163 \text{ Ом}$; $z_{1,2}^e = 149 \text{ Ом}$;
 $\lambda = 2 \text{ мм}$, б) $z_3 = 418 \text{ Ом}$; $z_4 = 79 \text{ Ом}$; $z_{3,4}^t = 66 \text{ Ом}$; $z_{3,4}^e = 62 \text{ Ом}$;
 $\lambda = 2 \text{ мм}$, в) $z_5 = 186 \text{ Ом}$; $z_6 = 237 \text{ Ом}$; $z_{5,6}^t = 104 \text{ Ом}$; $z_{5,6}^e = 88 \text{ Ом}$;
 г) $z_7 = 68 \text{ Ом}$; $z_8 = 68 \text{ Ом}$; $z_{7,8}^t = 34 \text{ Ом}$; $z_{7,8}^e = 19 \text{ Ом}$;
 $\lambda = 1 \text{ мм}$

$Z = Z_{i,j}^e$ и пунктирная при $Z = Z_{i,j}^t$) близки друг к другу, то они хорошо совпадают и с экспериментальными точками (рис. Ia и Ib), когда же они расходятся, то и экспериментальные точки не укладываются ни на одну из них (рис. Ic и Ig). При

этом отличие заметнее для р-поляризации. Таким образом, если комбинированной пленке можно приписать импеданс Z (рис. Iа и Iб), то он определяется соотношением (2), если же такой пленке нельзя приписать Z , определяемого (2), то ей нельзя приписать вообще никакого импеданса.

Соотношение (2) имеет простой физический смысл, который проиллюстрируем следующим рассуждением. Предположим, что расстояние между металлическими слоями в комбинированной пленке столь мало, что диэлектрическая прокладка не вносит дополнительных разрывов ни в электрическую, ни в магнитную компоненты поля. Тогда электрическая компонента не имеет разрыва и на всей комбинированной пленке, а магнитная имеет скачок, равный сумме скачков на металлических слоях. Скачок магнитной компоненты на каждом из металлических слоев пропорционален току в нем, поэтому суммирование скачков магнитного поля эквивалентно суммированию токов. Каждый из токов, в свою очередь, пропорционален проводимости (обратному импедансу) соответствующего металлического слоя. Отсюда ясно, что соотношение (2) отвечает параллельному соединению импедансов z_1 и z_2 .

Из сказанного следует, что комбинированные пленки рис. Iа и Iб являются электродинамически тонкими, т.е. они полностью электродинамически эквивалентны одиночным металлическим пленкам с соответствующими коэффициентами пропускания. Однако геометрическая толщина d комбинированных пленок не может быть меньше двойной толщины лавсановых подложек, т.е. $d \geq 2d_1 \approx 20$ мкм.

Таким образом мы получили электродинамически тонкие металлические пленки, геометрическая толщина которых много больше не только единиц или десятков ангстрем, предсказываемых для металлических пленок с аналогичными импедансами по /9-II/, но и характерных глубин скин-слоев для металлов (доли микрон). Это показывает несостоятельность попыток связывать величину d реальных металлических пленок с их электродинамическими свойствами в миллиметровом или субмиллиметровом диапазоне без детальной информации об их внутренней структуре /8/.

Комбинированные пленки рис. Iв и Iг оказались электродинамически не тонкими. Это следует из невыполнения соотношений как (2), так и (I) ни при каких Z . Дополнительным указанием на отклонение пленки от тонкости может служить заметная зависи-

мость от частоты величины T , наблюдавшаяся у пленок Iв и Iг.

Можно показать, что в комбинированных пленках такого типа малость толщины диэлектрической прокладки по отношению к λ является необходимым, но не достаточным условием электродинамической тонкости комбинированной пленки в целом. Последнее обстоятельство зависит также и от импедансов металлических слоев, обрамляющих диэлектрик. По-видимому, этим объясняется тот факт, что исследованные комбинированные пленки тем хуже подчинялись импедансной модели, чем меньше были импедансы отдельных слоев, их образующих.

Поступила в редакцию
14 января 1983 г.

Л и т е р а т у р а

1. Ю. В. Троицкий, Одночастотная генерация в газовых лазерах, "Наука", Новосибирск, 1975 г.
2. В. В. Гаврилин, Ю. К. Григулис, Изв. АН Латв. ССР, сер. физ. и техн. наук, № 4, 70 (1976).
3. Н. А. Ирисова, А. Б. Латышев, Препринт ФИАН № 232, М., 1981 г.
4. Е. А. Виноградов и др., Препринт ФИАН № 35, М., 1982 г.
5. Е. А. Виноградов и др., Краткие сообщения по физике ФИАН № 12, 53 (1981).
6. Е. А. Виноградов и др., ЖТФ, 52, 573 (1982).
7. Е. А. Виноградов и др., Краткие сообщения по физике ФИАН № 8, II (1982).
8. В. А. Конев, Н. Н. Пунько, Дефектоскопия, № 6, 31 (1980).
9. W. Woltersdorff, Zeitschrift für Physik, 91, 230 (1934).
10. А. Е. Каплан, Радиотехника и электроника, 9, 1781 (1964).
11. В. В. Слуцкая, Тонкие пленки в технике СВЧ, Гостехиздат, М-Л., 1962.
12. Г. В. Розенберг, Оптика тонкослойных покрытий, ГИФМи, М., 1958 г.